**Ермаков, Виктор Анатольевич. Исследование структурно-химических параметров тонких пленок, наностеклокерамики и многослойных нанографитов методами спектроскопии комбинационного рассеяния света : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.05 / Ермаков Виктор Анатольевич; [Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т информац. технологий, механики и оптики].- Санкт-Петербург, 2011.- 113 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-1/777**